

참가희망자는 반드시 참가신청서를 보내 주시기 바라며 참가신청서를 보내주신 분에 한하여 관련자료를 드립니다.

문의처

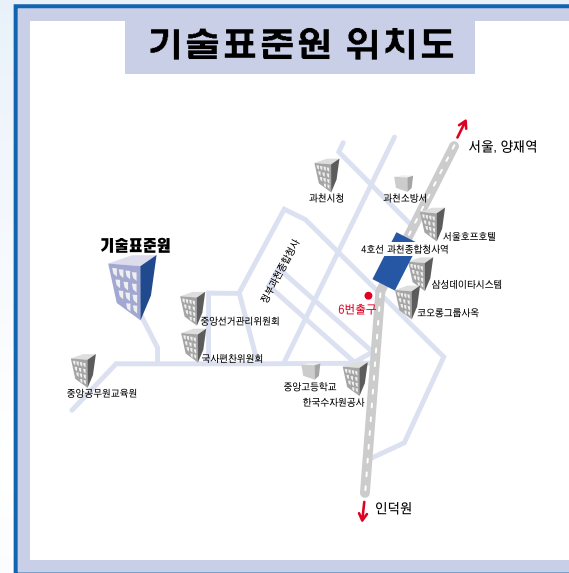
기술표준원 기간산업기술표준부
소재부품표준과
(02)509-7292, 7293

보내실 곳

가능한한 E-mail 또는 Fax로 참가신청을 해주시기 바라며 발송 후 확인전화를 부탁드립니다.

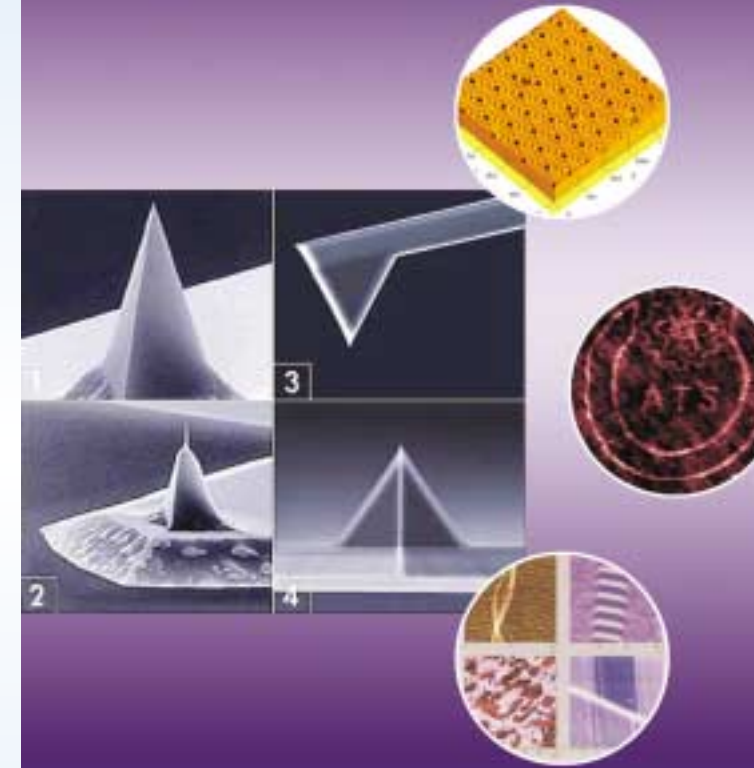
- > T E L : (02)509-7292, 7293
- > F A X : (02)509-7316
- > E-mail : material@ats.go.kr
- > 주 소 : 427-010

경기도 과천시 중앙동 2번지
산업자원부 기술표준원
소재부품표준과



- 지하철 이용시 : 지하철 4호선 정부과천청사역 6번 출구
- 버 스 이용시 : 정부과천청사 앞 하차
- 09:00부터 셔틀버스가 수시로 운행됩니다.

나노분석기술의 국제표준화 동향 및 원자현미경의 역할



일시 : 2004. 8. 23 (월) 13:30~17:15

장소 : 기술표준원 중강당

• 주최/주관 : 산업자원부 기술표준원

21세기 접어들면서 신산업 분야에 나노기술이라는 첨단신기술이 도입됨에 됨에 따라 전세계적으로 이 분야에 대한 관심이 크게 집중되고 있습니다.

나노란 10억분의 1을 의미하며 1 나노미터(nm)는 원자 3~4개를 모아 놓은 크기로서 나노기술은 수 나노미터 크기의 원자나 분자를 조작하여 새로운 특성을 갖는 재료, 소자, 공정 및 시스템 등을 창출하는 기술을 말합니다.

이와 같은 나노기술은 그 기반이 측정에 근거를 둔 것으로서 표준이라는 개념과 별개로 생각할 수 없는 분야입니다. 이에 따라 산업자원부 기술표준원은 현재 국제표준을 관장하고 있는 국제표준화기구(ISO)에 이 분야에 대한 표준화의 필요성에 대해 강조하였고 2004년 3월 원자현미경 분야에 대한 국제간사국을 수임하여 국제표준을 실질적으로 선도해 나갈 수 있는 계기를 마련하였습니다.

따라서 이번 세미나는 이를 계기로 나노분석, 특히 원자현미경 분야에 대한 국내외 관계자들의 관심을 집중시키고 첨단 원자측정기술의 보급을 위한 자리로 마련하였으니 바쁘시더라도 꼭 참석하시어 국내 나노 분석기술 발전을 위하여 참가신청하여 주시기 바랍니다.

2004년 8월

산업자원부 기술표준원장 윤교원

| 시 간 | 내 용 | 비 고 |
|-------------|---|--|
| 13:30~13:40 | 축 사 | 윤교원 원장 (기술표준원) |
| 13:40~13:45 | 인 사 말 | 이해성 박사 (한국기초과학 지원연구원) |
| 13:45~14:05 | The State of Art in ISO/TC201 Standardization (Nano Analysis Technology) | Dr. Yoshihara (Vice President, National Institute of Materials Science) |
| 14:05~14:35 | Recent Advances in Scanning Tunneling Microscopy | 국 양 교수 (서울대학교 물리학과) |
| 14:35~15:05 | 나노분석의 현황과 전망 | 문대원 그룹장 (한국표준과학연구원 나노표면그룹) |
| 15:05~15:15 | Coffee Break | |
| 15:15~15:45 | Nanoscale Metrology with AFM and Its Industrial Applications | 박상일 사장 (PSIA) |
| 15:45~16:15 | Development of a length- unit traceable atomic force microscope for dimensional nanometrology at NMIJ | Dr. Kurosawa (National Metrology Institute of Japan) |
| 16:15~16:35 | 원자현미경을 이용한 나노 응착 /마찰 측정기술 및 표준화 | 윤익성 박사 (KIST) |
| 16:35~16:55 | 근접장광학현미경(NSOM)을 이용한 나노분석기술 | 김정용 박사 (인천대학교) |
| 16:55~17:15 | TC201/SC9(원자현미경) 분야의 표준화 현황 및 향후 추진계획 | 신재혁 박사 (기술표준원) |

> 수 신 : 기술표준원 소재부품표준과
[Fax : (02)509-7316]
> 제 목 : 나노분석기술의 국제표준화 동향 및
원자현미경의 역할 세미나 참가신청서
제출

- 참가 신청서 -

- 기관명 : _____
- 담당자 : _____
- 전 화 : _____ • FAX : _____
- E-mail : _____

| 성 명 | 부 서 | 직 위 | 비 고 |
|-----|-----|-----|-----|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

상기와 같이 귀 원에서 주관하는 세미나 참가를
신청합니다.

2004. 8.

신청인 :